

**Schichtdicken-
messgerät
LAYERCHECK
750 USB**

**Modell 750 USB-F
für alle
nichtmagnetischen
Schichten auf Stahl**

**Modell 750 USB-FN
für alle
nichtmagnetischen
Schichten auf Stahl und
alle isolierenden
Schichten auf NE-Metallen**



testing equipment for quality management

ERICHSEN
since 1910

Technische Beschreibung

**Messverfahren konform
zu DIN, ISO, BS, ASTM**

**Universal-Sonde (FN) mit
automatischer
Messtechnik
für Messungen auf Stahl
und auf NE-Metallen**

Zweck und Anwendung

Das kleine und robuste Schichtdickenmessgerät **LAYERCHECK 750 USB** wird für die schnelle und genaue, **zerstörungsfreie** Schichtdickenmessung auf metallischen Untergründen eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind z.B. industrieller Korrosionsschutz, Gutachter-, Galvanisier- und Lackierbetriebe, chemische Industrie, Automobil-, Schiffs-, Flugzeug-, Apparate- und Maschinenbau.

Ausführung und Funktion

Das Gehäuse des **LAYERCHECK 750 USB** besteht aus einem harten, verschleißfesten Werkstoff und bietet durch seine Gummiumrandung einen zusätzlichen optimalen Stoßschutz. Für Messungen in dunkler Umgebung ist das Schichtdickenmessgerät mit einem großflächigen, beleuchteten LC-Display ausgestattet.

Die batteriebetriebenen Schichtdickenmessgeräte arbeiten je nach Gerätetyp und Sonde nach dem magnetisch-induktiven Verfahren (F) **oder** zusätzlich auch (Kombinationssonde – FN) nach dem Wirbelstrom-Verfahren.

Der **LAYERCHECK 750 USB-F** ist mit seinem magnetisch-induktiven Verfahren geeignet zur Messung unmagnetischer Schichten wie z.B. Lacke, Aluminium, Chrom, Kupfer, Zink, Emaille, usw. auf Eisen, Stahl, sowie auf legierten und gehärteten magnetischen Stählen.

Der **LAYERCHECK 750 USB-FN** verwendet sowohl das magnetisch-induktive als auch das Wirbelstrom-Verfahren. Eine Kombinationssonde ermöglicht das Messen entsprechender Beschichtungen, sowohl auf dem Grundwerkstoff Stahl, als auch auf NE-Metallen. Der Automatikmodus garantiert das richtige Messverfahren, gleichgültig, ob auf Stahl oder NE-Metall gemessen wird. Das Gerät erkennt dies selbständig und zeigt bei der Messung an, welcher Untergrund vorliegt.

Die Sonde wird an einer federnden Griffhülse gehalten, was ein sicheres und kippfreies Aufsetzen bei konstanter Auflagekraft gewährleistet. Der halbkugelförmige Messpol besteht aus hartem, verschleißfesten Werkstoff. Die einpolige Messsonde ist über ein Kabel (Länge 1 m) mit dem Gerät verbunden.

Zum Datenexport von Messwerten während der Messung wie auch zur späteren Anzeige oder Export der Statistik kann der **LAYERCHECK 750 USB** über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden werden. Zur Datenübertragung dient die im Lieferumfang enthaltene dreisprachige Software Msoft7000 basic edition (CD), welche zusätzlich noch unter www.erichsen.de/service/downloads als kostenloser Download zur Verfügung steht.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x T)	ca. 122 x 70 x 32 mm
Sonde	Ø 15 mm x 62 mm
Gewicht	ca. 225 g
Messbereiche	
Modell 750 USB-F	0 - 3000 µm
Modell 750 USB-FN	0 - 2000 µm (F) 0 - 2000 µm (N)
Messunsicherheit	± (2% + 2 µm) vom Messwert
Kleinster Krümmungsradius des Messgegenstandes	konvex: 5 mm konkav: 25 mm
Kleinste Messfläche	Ø 20 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffs	0,5 mm (F) 50 µm (N)
Display	4-stellig, Ziffernhöhe 11 mm
Maßeinheiten	µm – mils umschaltbar
Kalibrierung	Standard-, 1-Punkt-, 2-Punkt-Kalibrierung
Statistikberechnung	aus max. 9999 Messwerten
Speicherung	Mittelwert, Standardabweichung Anzahl der Messwerte größter/kleinster Messwert
Schnittstelle	USB
Stromversorgung	3 Micro-AAA-Batterien (>10000 Messungen)
Umgebungstemperatur	Gerät: 0 - 50 °C Sonde: -10 °C - 70 °C

Bestellinformation	
Best.-Nr.	Produkt-Bezeichnung
0304.01.31	Schichtdickenmessgerät LAYERCHECK 750 USB-F einschl. Sonde für Messungen auf Stahl
0305.01.31	Schichtdickenmessgerät LAYERCHECK 750 USB-FN einschl. Kombinationssonde für Messungen auf Stahl <u>und</u> NE-Metallen

Weitere Informationen sowie Zubehör (z.B. verschiedene Kalibrierfolienausführungen) entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Technische Änderungen vorbehalten.
Gruppe 10- TBD 750 – VIII/2012